



<b>Title of Change:</b>	1.3 mil gold to 1.0 mil Palladium Coated Copper (PCC) wire conversion for gate wire bonding on PQFN Packages qualification	
<b>Proposed First Ship date:</b>	29 September 2019	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <ernesto.villamor@onsemi.com> or <a href="mailto:sheila.ovao@onsemi.com">sheila.ovao@onsemi.com</a>	
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a>	
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
<b>Change Part Identification:</b>	Affected products will be identified with date code.	
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: OSPI- Cebu	External Foundry/Subcon Sites: None
<b>Description and Purpose:</b>		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Bond Wire	1.3 mil Gold gate wire only	1.0 mil Palladium Coated Copper (PCC) gate wire only
There is no product marking change as a result of this change		



## Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: FDMD82100  
 RMS: F47535  
 PACKAGE: PQFN12 AU COMP HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs

QV DEVICE NAME: FDMS3606S  
 RMS: F50287  
 PACKAGE: PQFN8 CUAU COMP HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs



**QV DEVICE NAME: FDMS86255**  
**RMS: F50349**  
**PACKAGE: PQFN8 AU SNGL HPBF**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs

**QV DEVICE NAME: FDMC86260**  
**RMS: F51526**  
**PACKAGE: PQFN8 AU SNGL HPBF**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

Estimated date for qualification completion: 2 April 2019

**Electrical Characteristic Summary:** To be updated

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDMC8010	FDMC86260
FDMC8010ET30	FDMC86260
FDMC86160ET100	FDMC86260
FDMC86340	FDMC86260
FDPC8011S	FDMC86260
FDMC86012	FDMC86260
FDMC86570L	FDMC86260
FDMC012N03	FDMC86260
FDMC86160	FDMC86260
FDMC86260	FDMC86260
FDMC86260ET150	FDMC86260
FDPC8012S	FDMC86260
FDPC8013S	FDMC86260
FDMC86259P	FDMC86260
FDMC8360L	FDMC86260
FDMD8280	FDMD82100
FDMD82100	FDMD82100
FDMS86150A	FDMS86255
FDMS8050ET30	FDMS86255
FDMS86255ET150	FDMS86255
FDMS86350ET80	FDMS86255
FDMS86550ET60	FDMS86255
FDMS8050	FDMS86255
FDMS8350L	FDMS86255
FDMS86150	FDMS86255
FDMS86150ET100	FDMS86255
FDMS86152	FDMS86255
FDMS86202	FDMS86255
FDMS86204	FDMS86255
FDMS86255	FDMS86255
FDMS86350	FDMS86255
FDMS86550	FDMS86255



# Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22659X

Issue Date: 29 March 2019

FDMS3604S	FDMS3606S
FDMS3660S	FDMS3606S
FDMS3664S	FDMS3606S
FDMS3668S	FDMS3606S
FDMS3669S	FDMS3606S
FDMS3669S-SN00345	FDMS3606S
FDMS3660AS	FDMS3606S
FDMS3606S	FDMS3606S

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号#: IPCN22659X

発行日: 29 March 2019

変更件名:	PQFN パッケージにおけるゲートワイヤボンディングの 1.3 mil 径 金から 1.0 mil 径 パラジウム被膜銅 (PCC) ワイヤへの変更							
初回出荷予定日:	29 September 2019							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <ernesto.villamor@onsemi.com> <sheila.oyao@onsemi.com> にお問い合わせください。							
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。							
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がございましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。							
変更部品の識別:	影響を受ける部品は、日付コードによって識別されます。							
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____							
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____							
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: OSPI- Cebu	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし						
説明および目的:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 35%;">変更前の表記</th> <th style="width: 40%;">変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ボンドワイヤ</td> <td style="text-align: center;">1.3 mil 径 金ゲートワイヤのみ</td> <td style="text-align: center;">1.0 mil 径 パラジウム被膜銅 (PCC) ゲートワイヤのみ</td> </tr> </tbody> </table> <p>この変更の結果として、製品マーキングが変更されることはありません</p>			変更前の表記	変更後の表記	ボンドワイヤ	1.3 mil 径 金ゲートワイヤのみ	1.0 mil 径 パラジウム被膜銅 (PCC) ゲートワイヤのみ
	変更前の表記	変更後の表記						
ボンドワイヤ	1.3 mil 径 金ゲートワイヤのみ	1.0 mil 径 パラジウム被膜銅 (PCC) ゲートワイヤのみ						



## 認定計画

デバイス名: FDMD82100

RMS: F47535

パッケージ: PQFN12 AU COMP HPBF

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs

デバイス名: FDMS3606S

RMS: F50287

パッケージ: PQFN8 CUAU COMP HPBF

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs





**デバイス名: FDMS86255**  
**RMS: F50349**  
**パッケージ: PQFN8 AU SNGL HPBF**

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs

**デバイス名: FDMC86260**  
**RMS: F51526**  
**パッケージ: PQFN8 AU SNGL HPBF**

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

認定完了予定日: 2 April 2019



## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDMC8010	FDMC86260
FDMC8010ET30	FDMC86260
FDMC86160ET100	FDMC86260
FDMC86340	FDMC86260
FDPC8011S	FDMC86260
FDMC86012	FDMC86260
FDMC86570L	FDMC86260
FDMC012N03	FDMC86260
FDMC86160	FDMC86260
FDMC86260	FDMC86260
FDMC86260ET150	FDMC86260
FDPC8012S	FDMC86260
FDPC8013S	FDMC86260
FDMC86259P	FDMC86260
FDMC8360L	FDMC86260
FDMD8280	FDMD82100
FDMD82100	FDMD82100
FDMS86150A	FDMS86255
FDMS8050ET30	FDMS86255
FDMS86255ET150	FDMS86255
FDMS86350ET80	FDMS86255
FDMS86550ET60	FDMS86255
FDMS8050	FDMS86255
FDMS8350L	FDMS86255
FDMS86150	FDMS86255
FDMS86150ET100	FDMS86255
FDMS86152	FDMS86255
FDMS86202	FDMS86255
FDMS86204	FDMS86255
FDMS86255	FDMS86255
FDMS86350	FDMS86255
FDMS86550	FDMS86255
FDMS3604S	FDMS3606S



# 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号#: IPCN22659X

発行日: 29 March 2019

FDMS3660S	FDMS3606S
FDMS3664S	FDMS3606S
FDMS3668S	FDMS3606S
FDMS3669S	FDMS3606S
FDMS3669S-SN00345	FDMS3606S
FDMS3660AS	FDMS3606S
FDMS3606S	FDMS3606S